

産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会 審査基準専門委員会の開催及び結果について

第8回審査基準専門委員会（平成24年11月12日（月））及び第9回審査基準専門委員会（平成25年1月10日（木））を開催し、「発明の単一性の要件」及び「発明の特別な技術的特徴を変更する補正」（いわゆるシフト補正）の審査基準の見直しについて検討を行った。

<検討の背景>

現行の「発明の単一性の要件」、「発明の特別な技術的特徴を変更する補正」の運用に対して、ユーザー等から、以下の指摘がされている。

- 審査対象となる範囲が狭くなることがあり、特許される可能性のある発明について、十分な保護を得ることができないケースがある。
- いずれの要件も無効理由とされていないことに鑑み、柔軟な判断を行うべきである。

そこで、上記指摘を踏まえ、対応する審査基準の見直しを検討することとした。

<検討の結果>

ユーザーニーズ等を踏まえ、発見された「特別な技術的特徴」¹を有する全ての発明を審査対象とすることによって審査される範囲を広げると共に、審査の効率性の観点に基づいて柔軟に審査対象を拡大することができるように、審査基準改訂の骨子²がとりまとめられた（審査基準改訂の方向性について、**別添**を参照）。

今後、当該骨子に基づいて審査基準改訂案を作成し、パブリックコメント等を経て、審査基準改訂を行う予定である。

¹ 「特別な技術的特徴」とは、発明の先行技術に対する貢献を明示する技術的特徴をいう（特許法施行規則第25条の8第2項）。

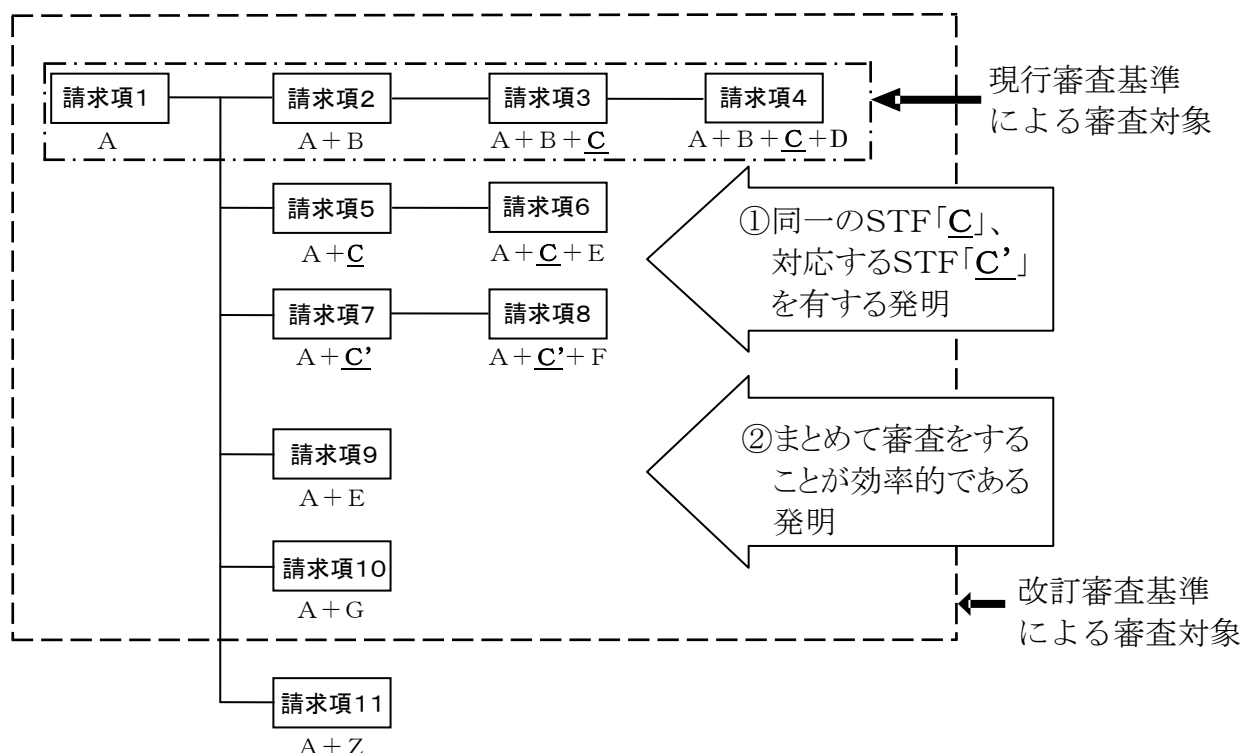
² 産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会第9回審査基準専門委員会**資料5**を参照。

「発明の単一性の要件」・「発明の特別な技術的特徴を変更する補正」 の審査基準改訂の方向性

現行の「発明の単一性の要件」の審査基準では、特許請求の範囲の最初に記載された発明（請求項1に係る発明）が特別な技術的特徴（S T F）を有しない場合、これに従属する最初の一列を構成する発明において最初に特別な技術的特徴（S T F）が発見された発明の発明特定事項を全て含む発明を審査対象としている。

改訂後の審査基準では、上記「最初に特別な技術的特徴（S T F）が発見された発明の発明特定事項を全て含む発明」に加えて、当該特別な技術的特徴（S T F）と同一の又は対応する特別な技術的特徴（S T F）を有する発明を審査対象とする（①）。また、審査対象とされた発明とまとめて審査をすることが効率的である発明については、広く審査対象に加える（②）。

また、「発明の特別な技術的特徴を変更する補正」の審査基準も、改訂後の「発明の単一性の要件」の審査基準と同様の考え方に基づいて、シフト補正の要件を問わない範囲を拡大する。



【図】 請求項3にS T Fとして「C」が発見された場合の審査対象